

## 2025 年度製造工程検査部門シンポジウム 講演募集

本シンポジウムでは画像を用いた外観検査・非破壊検査に関する講演を幅広く募集します。特に、機械学習を用いた検査方法を検討している研究、あるいは、学習に用いる画像データセットに関する研究を募集します。また、当協会の会員ではない方の講演・参加も歓迎します。現場からの生の声、検査が可能であることを示したもののその理論的解釈に苦しんでいる例、結果が予想と異なってしまい困っている例などのご発表も歓迎します。

We welcome presentations in English by students and researchers from abroad. We will gratefully appreciate your contribution to the symposium.

主な募集テーマのカテゴリー（下記に属さないテーマも歓迎します。）

### テーマセッション

#### 外観検査・非破壊検査に関するもの

- (1) 画像を用いた外観検査・非破壊検査
- (2) 機械学習を用いた検査手法
- (3) 画像データセットに関する研究
- (4) X線、CT、赤外線等の画像を用いた検査

### 一般セッション

#### 画像処理、画像認識、形状計測等に関するもの

- (1) 画像を用いた物体の認識
- (2) 機械学習を用いた画像理解
- (3) 画像からの3次元情報の抽出・復元やその応用
- (4) 画像を用いた物体制御 等

主 催 : (一社)日本非破壊検査協会 製造工程検査部門

会 期 : 2026年3月26日(木)～27日(金)

開催形式 : 完全対面(会場:愛知工業大学 本山キャンパス3階304室)

参 加 費 : [消費税込]

JSNDI 正会員	4,000円
登壇者(学生会員の方は3,000円)	4,000円
学生会員	3,000円
非会員 一般	8,000円
非会員 学生	4,000円

講演申込締切 : 2026年1月23日(金) → 1月30日(金)まで延長

講演論文締切 : 2026年2月25日(水) → 3月4日(水)まで延長

参加申込締切 : 2026年3月18日(水)

講演論文集 : PDFで配信いたします。

講 演 論 文 : 2頁、4頁、または6頁(英語論文及び英語での発表可。執筆要領は受付後送付します)。

講演申込方法 : 製造工程検査部門ホームページ(<https://sciences.jsndi.jp/manu/studygroup/symposium/>)よりお申し込み下さい。講演申込受付後、受付確認のご連絡を差し上げます。受付確認の連絡が届かない場合は、ご連絡くださいますようお願いいたします。

問合先 : 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-25-14 京阪亀戸ビル10階

(一社)日本非破壊検査協会 学術課

「2025年度製造工程検査部門シンポジウム」係

TEL: 03-5609-4015 E-mail: beppu@jsndi.or.jp

注) シンポジウム会期中に満30歳以下の登壇者は新進賞の選考対象となります。授賞対象者は、当協会正会員(個人会員、団体会員の登録者)及び学生会員であり、非会員については、後日会員になることが条件です。但し、既受賞者は対象外(学術関連の他賞を含む)です。上記の条件に該当する発表者は講演申込に会員資格・生年月日・年齢を必ずご記入の上、お申し込み下さい。記入がない場合は審査対象外となりますので、ご注意下さい。

・各セッション及び特別講演の全てにおいて、会場の発表資料の撮影(録画)、録音、保存、印刷等の行為は禁止します。

・当会で行われた講演の抄録については、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下JST)が管理する文献データベース(JDreamIII、J-GLOBAL)への収録および人工知能「AI」に関連する利用が行われる場合がありますので、予めご了承ください。なお、抄録はJSTの著者抄録利用方法により取り扱われます。